

## **ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ОКСИДИРОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТАЛЛОВ НА КРЕМНИИ**

*Тутов Е.А., Рябцев С.В., Логачева В.А., Тутов Е.Е.,  
Бормонтов Е.Н., Ховив А.М.*

Окислительным отжигом тонких пленок олова, вольфрама, палладия и цинка на кремнии сформированы структуры металл–оксид–полупроводник и измерены их высокочастотные (1 МГц) вольт-фарадные и вольт-сименсные характеристики. Последние представлены как динамические вольт-амперные характеристики. Для нестехиометрических оксидов олова, вольфрама и палладия обнаружены общие особенности в энергетическом спектре плотности поверхностных состояний.